



تاثیر راستای رشد فیلم نازک ZnO بر خواص اپتیکی آن

عمار مهاجران، فریبا احمدی و احمد یزدانی

گروه حالت جامد، بخش فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی ۱۷۵-۱۴۱۱۵، تهران

چکیده - در این مقاله با استفاده از محاسبات بنیادی توسط بسته WIEN2K، پارامترهای اپتیکی و الکترونیکی فیلم نازک اکسید روی رشد داده شده در راستاهای مختلف بدست آمده است. مشاهده خواهد شد که خواص الکترونیکی و اپتیکی این ترکیب به مقدار زیادی به راستای رشد آن بستگی دارد. با تغییر راستای رشد، چینش اتمهای سطح نیز تغییر می‌کند که این خود موجب تغییرات الکترونیکی و اپتیکی می‌شود. در این گزارش، ساختارهای نواری و نمودارهای تابع دی‌الکتریک ZnO، به منظور بررسی تغییرات الکترونیکی و اپتیکی، ارائه شده است.

کلید واژه- تابع دی الکتتریک، ساختار نواری، فیلم نازک، WIEN2K.

Effect of growth direction on optical properties of ZnO thin film

Ammar Mohajeran, Fariba Ahmadi and Ahmad Yazdani

Department of Physics, Tarbiat Modares University, P.O.Box 14115-175, Tehran, Iran

Abstract- In this article, optical and electronic properties of the grown ZnO thin film are gained in various directions by means of the first principles calculations, using WIEN2K package. Here it is proved that electronic and optical properties of ZnO are extensively depended on its growth direction. When direction of growth is altered, the arrangement of surface atoms is consequently changed, leading to electronic and optical changes. In this report, band structures and dielectric function graphs of ZnO are presented to study electronic and optical variations.

Keywords: Band structure, Dielectric function, Thin film, WIEN2K.

مقدمه

در سالهای اخیر تلاشهای گسترده ای در راستای تولید فیلمهای نازک شفاف به دلیل کاربرد های بالقوه ای آن در الکتروندهای شفاف نمایشگرها، ناشر میدان، نشر لیزر فرابنفش، ردیابهای نوری، پیزوالکتریسیته، بیوسنسورها، دیودهای نوری با طول موج کوتاه و تکنولوژی اطلاعات [1-5] شده است. اکسید روی ماده ای مناسبی برای اینگونه کاربردها می باشد. اکسید روی نیمه رسانای نوع n با گاف مستقیم حدود 3.37(eV) و انرژی اکسیتونی 60(meV) در دمای اتاق است. نظم میکروسکوپی سطح و ساختار بلوری فیلم های رسانای شفاف تاثیر بسیاری بر عملکرد سلولهای خورشیدی دارد. برای اینگونه کاربردها، توسعه ای فیلم های نازک اکسیدی رسانای شفاف با سطوح تار و پودی بسیار مهم است [6,7]. وجود تار و پود مزیت والایی است برای کاربرد در سلول های خورشیدی زیرا باعث افزایش پراکندگی نور به لایه های فعال سلول و افزایش طول مسیر اپتیکی [8] و در نتیجه تولید حامل های آزاد می شود. اکسید روی دارای ساختار کریستالی شش وجهی با گروه فضایی P6₃mc است. پارامتر های شبکه a=3.249(Å) و c=5.207(Å) با جایگاههای Zn(2/3,1/3,0)، O(2/3,1/3,0,345) است. ساختار ZnO را می توان به مانند صفحاتی متشکل از O²⁻ و Zn²⁺ هایی در نظر گرفت که به صورت چهاروجهی در راستای c تکرار شده اند. ساختار چهاروجهی ZnO باعث یک تقارن غیر مرکزی و خاصیت پیزوالکتریکی می شود. ویژگی مهم دیگر ZnO وجود صفحات قطبی آن است. مشهودترین صفحات قطبی ZnO صفحه ای پایه آن است (عمود بر بردار نرمال [0001])

یون های با بار مخالف صفحات قطبی Zn-(0001) مثبت و O-(0001⁻) منفی به وجود می آورند که منجر به یک ممان دوقطبی و پلاریزاسیون خود به خودی در راستای c می شوند. صفحه قطبی دیگر (011⁻1) است. با تصویر کردن ساختار در راستای [12⁻10]، علاوه بر

صفحات قطبی مرسوم (0001)[±] که با Zn و O تعیین می شوند، (101⁻1)[±] و (101⁻1⁻)[±] نیز صفحات قطبی هستند.

{101⁻1} گونه صفحات در ZnO معمول نیست، اما در نانو ساختارهای مارپیچی مشاهده شده اند [9].

بارهای روی صفحات قطبی بارهای یونی هستند که قابل شارش یا انتقال نیستند. به دلیل اندرکنش بین بارهای توزیع شده روی صفحات، ساختار به گونه ای منظم می شود که انرژی الکترواستاتیکی را کمینه کند.

در این مقاله تاثیر راستای رشد که منجر به ساختارهای متفاوت می شود، بررسی شده است.

روش تهیه مقاله

در این مقاله تمام محاسبات اپتیکی با استفاده از بسته ای WIEN2K [10] با پایه های APW+lo (LAPW) انجام شده است. برای لحاظ کردن پتانسیلهای تبدالی و همبستگی از تقریب GGA استفاده شده است.

در این برنامه تانسور دی الکتریک مختلط به صورت [11]

$$\begin{aligned} \text{Im } \varepsilon_{\alpha\beta}(\omega) &= \frac{4\pi e^2}{m^2 \omega^2} \sum_{C,K} dk \langle C_K | P^\alpha | V_K \rangle \langle V_K | P^\alpha | C_K \rangle \\ &\times \delta(\varepsilon_{C_K} - \varepsilon_{V_K} - \omega) \quad (1) \\ \text{Re } \varepsilon_{\alpha\beta}(\omega) &= \varepsilon_{\alpha\beta} + \frac{2}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\omega' \text{Im } \varepsilon_{\alpha\beta}(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (2) \end{aligned}$$

به کار برده می شود. در معادلات بالا C_K و V_K توابع موج کریستالی مربوط به باند رسانش و ظرفیت هستند با بردار موج کریستالی K. جمع در معادله ای اول بر روی تمام حالت های ظرفیت و رسانش است که با اندیس V و C نشان داده شده اند.

علاوه بر این می توان ثابت دی الکتریک مختلط را به صورت: $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$ نوشت.

باقی پارامترهای اپتیکی را می توان از روی مولفه های تابع دی الکتریک مختلط به دست آورد. با روشهای مختلف می توان فیلم های نازک گوناگونی در راستاهای متفاوت تولید کرد، از جمله در راستاهایی مانند [0001]،

[10-10]، [10-11]، [12].

بنا به ملاحظات تقارنی ما راستاهای :

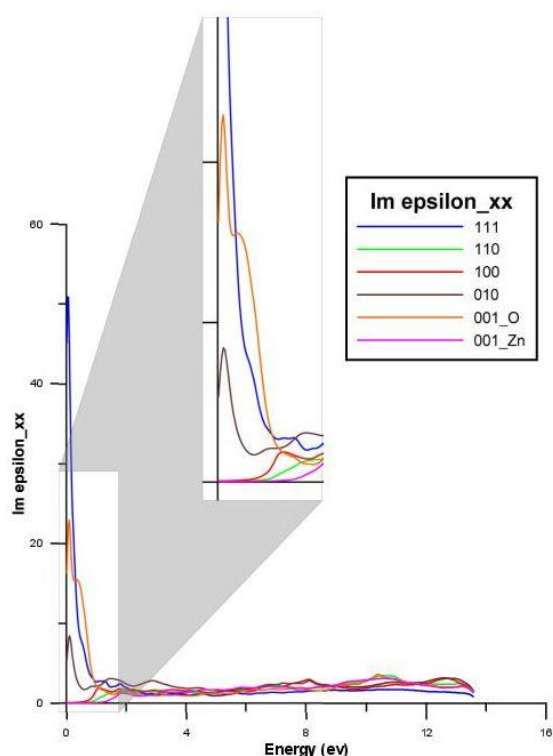
[0001]، [11-20]، [11-21]، [10-10]،

[01-10] را برگزیده‌ایم. چون نوع اتمهایی که بر روی سطح قرار می‌گیرند تاثیر زیادی بر خواص الکترونیکی و اپتیکی ماده دارند در نتیجه برای راستای [0001] که همان C می‌باشد، دو ساختار در نظر گرفته‌ایم، یک ساختار که به اتمهای O ختم می‌شود و دیگری که به اتمهای Zn. ضخامت تمام لایه‌ها تقریباً یکسان است (23.07~24 bohr). تفاوت اندک لایه‌ها به دلیل موقعیت گوناگون صفحات است. بنا به نمودارهای تابع دی‌الکتریک مختلط (شکل ۱-۲)، ساختارها را به دو گروه

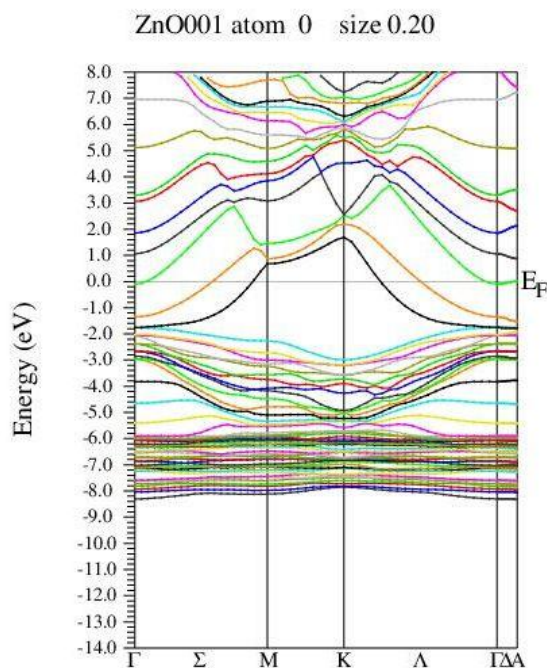
تقسیم می‌کنیم:

(۱) [11-21]، [01-10]، [0001]_O

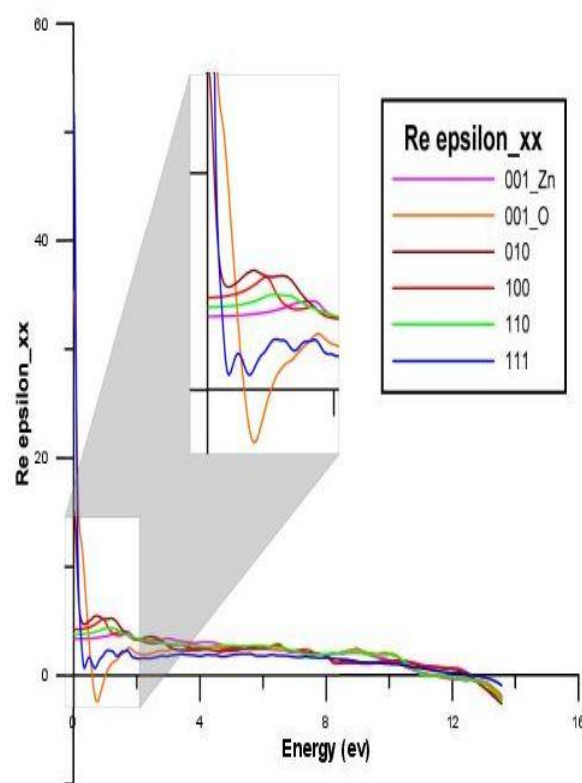
(۲) [11-20]، [10-10]، [0001]_Zn



شکل ۲: قسمت مختلط تابع دی‌الکتریک



شکل ۳: ساختار نواری فیلم نازک رشد داده شده در راستای [0001] که به اتمهای اکسیژن ختم می‌شود



شکل ۱: قسمت حقیقی تابع دی‌الکتریک

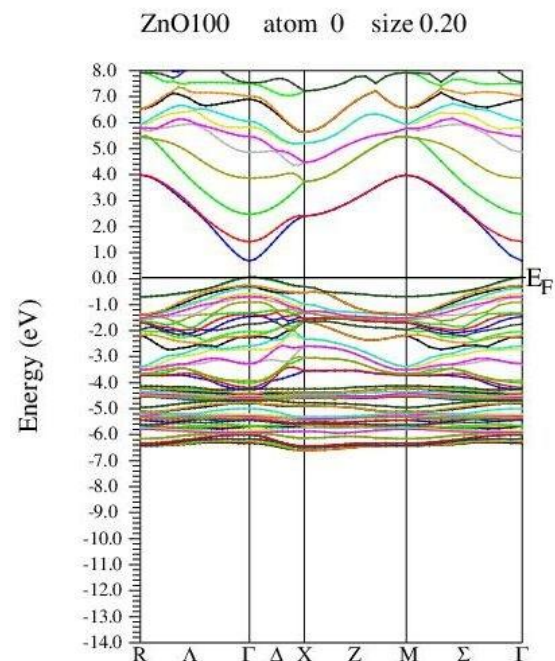
رشد داده شده در راستای [10-10] نیمه‌رسانایی با گاف انرژی حدود 0.6 eV است و ساختار دیگر در راستای [0001] فلز می‌باشد. تمام ساختارهایی که در یک گروه قرار داده شده‌اند از لحاظ اتمهای روی سطحشان با هم مشترک هستند در نتیجه، فلز یا نیمه‌رسانا بودن آنها را می‌توان به ترازهای الکترونی اتمهای روی سطح نسبت داد. می‌توان این نتایج را در جهت بهبود بازدهی سلولهای خورشیدی و ردیابهای نوری به کار برد.

سپاسگزاری

از جناب آقای محمدرضا صمدی‌شادلو برای همفکری و مباحثات پربارشان کمال تشکر را داریم.

مراجع

- [1] Z. K. Tang, G. K. L. Wong, P. Yu, M. Kawasaki, A. Ohtomo, H. Koinuma and Y. Segawa, Applied Physics Letters, Vol. 72, No. 25, June 1998, pp. 3270-3272.
- [2] Y. B. Li, Y. Bando and D. Golberg, Applied Physics Letters, Vol. 84, No. 18, May 2004, pp. 3603-3605.
- [3] A. Tsukazaki, A. Ohtomo, T. Onuma, M. Ohtani, T. Mankino, M. Sumiya, K. Ohtani, S. F. Chichibu, S. Fuke, Y. Segawa, H. Koinuma and M. Kawasaki, Nature Materials, Vol. 4, No. 1, January 2005, pp. 42-46.
- [4] S. H. Lee, S. S. Lee, J. J. Choi, J. U. Jeon and K. Ro, Microsystem Technologies, Vol. 11, No. 6, June 2005, pp. 416-423.
- [5] J. Q. Xu, Q. Y. Pan, Y. A. Shun and Z. Z. Tian, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 66, No. 1-3, July 2007, pp. 277-279.
- [6] H. Schade, Z.E. Smith, J. Appl. Phys. 57 (1985) 568.
- [7] S. Major, K.L. Chopra, Sol. Energy Mater. 17 (1988) 319.
- [8] C. Walker, R. Hollingsworth, J. Del Cueto, A. Madan, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 70 (1986) 563.
- [9] R. S. Yang, Y. Ding and Z. L. Wang, 2004, nano lett, vol.4, p.1309.
- [10] He'bert, C.1, January 2007, micron, vol.38, pp.12-28.
- [11] F. Wooten, "Optical properties of solids," Academic Press, New York, 1972.
- [12] Ziaul Raza, Khan, Mohd Shoeb Khan, Mohammad Zulfequar, Mohd Shahid Khan. 2011, material sciences and applications, vol.2, pp.340-345



شکل ۴: ساختار نواری فیلم نازک رشد داده شده در راستای [10-10]

قله‌های موجود در تابع دی الکتریک به گذارهای بین باند ظرفیت و باند رسانش مربوط می‌شود. قسمت مختلط تابع دی الکتریک نشان دهنده‌ی میزان جذب است، همانگونه که در شکل (۲) نمایان است ساختارهای گروه ۲ در بازه‌ی صفر تا یک الکترون‌ولت جذب ندارند و گروه ۱ دارای قله‌ی جذب هستند. قسمت حقیقی تابع دی الکتریک نشان دهنده‌ی میزان بازتاب است، در نتیجه بنا به شکل (۲)، مشاهده می‌شود که گروه ۲ در بازه‌ی مذکور دارای مقدار ثابت است و گروه ۱ از مقدار بیشینه خود به صورت نزولی کاهش می‌یابد. به علت کمبود فضا در مقاله برای نمونه از هر گروه یک ساختار نواری آورده شده است. ساختار [0001] به اتمهای O ختم می‌شود. میزان هیبریدشدگی s-p و sp-d اتمهای اکسیژن و روی خاصیت فلزی و نیمه‌رسانایی این ساختارها را تعیین می‌کنند.

نتیجه‌گیری

تاثیر راستای رشد فیلم نازک اکسید روی بر خواص اپتیکی آن به صورت محاسباتی بررسی شده است. از ساختارهای نواری نمونه مشاهده می‌شود که فیلم نازک